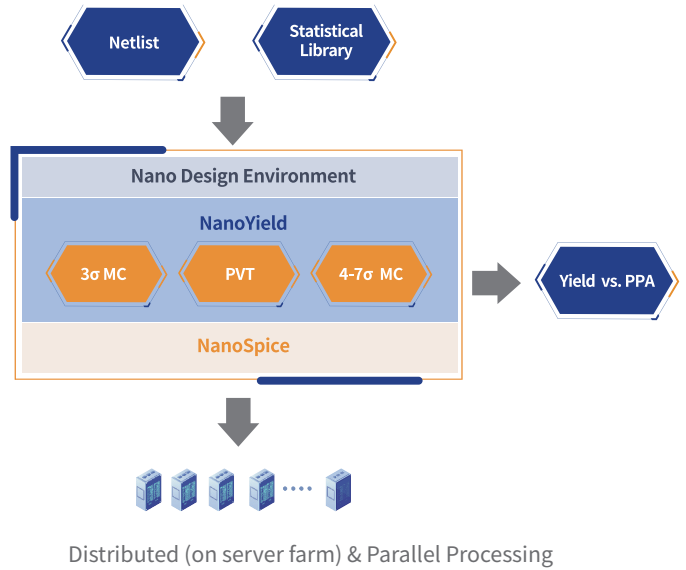


高西格玛良率分析解决方案

产品简介

NanoYield 是概伦电子自主研发的全集成良率导向设计平台，基于概伦独特的统计模型技术和 high-sigma 统计分析算法而打造，通过高效精准的统计算法和并行加速技术对统计电路仿真的性能进行无损精度的加速，对各种类型的电路包括存储器 / 数字电路 / 模拟电路等进行良率分析和设计优化。NanoYield 含有友好的电路设计分析环境，通过强大的图形化界面帮助用户在较短的时间内评估良率并可根据设计目标进行电路优化，从而提高芯片设计的一次成功率，优化芯片性能、提升良率从而提升产品竞争力。



产品优势

- 全集成:** 内置 SPICE 引擎和高效精准的统计算法
- 高性能:** 支持快速 PVT/蒙特卡罗/高西格玛分析功能
- 全并行:** 支持单机多核/服务器集群/公有云的并行加速
- 硅精准:** 经 40/28/14/7/5/3nm 等工艺节点验证
- 超经济:** 并行仿真授权模式，经济高效

技术规格

- 完整的 SPICE 分析功能
- 完整的 SPICE 模型支持
- 强大的图形分析和设计优化功能
- PVT、快速 PVT 和蒙特卡罗分析功能
- 全面兼容 HSPICE 和 Spectre 格式输入
- 系统级 high-sigma 用于全芯片级良率分析
- High-sigma 分析 (4-7σ+): 10 万以上的变量
- 丰富的良率预测、优化和统计分析功能: 敏感度分析, 参数扫描分析等

产品应用

- 存储器单元和阵列的良率预测和优化
- 模拟电路和数字电路的良率预测和优化
- 代工厂和 IDM 公司工艺开发过程中 SRAM 良率提升

Fast-PVT 和 high-sigma 分析示例

